

Laagdiktemeter LAYERCHECK 750 USB

Contactvrije meting op metalen ondergronden / Incl.- software
Meetmethode conform DIN, ISO, BS, ASTM / Kabellengte van de sonde 1m

De nieuwe MEGA-CHECK pocket meter gebruikt digitale meetsondes, waarbij analoge signalen direct in de sonde gedigitaliseerd worden en via de sondekabel digitaal aan het meetinstrument overgedragen worden. Deze nieuwe techniek is non-destructief en zorgt voor zeer precieze reproduceerbare metingen. De sondekabel is insteekbaar aan beide kanten (apparaat en de sonde) en bijzonder service vriendelijk, gezien er bij een kabelbreuk alleen de kabel vervangen dient te worden. Het handige formaat van de behuizing met de rubberen zijanten is amper groter dan de meetsonde. Door de nieuwe ASR-techniek (Automatic-Statistic-Result) is het mogelijk, de statistiek van de laatste meetreeksen weer te geven. Hiervoor wordt simpelweg de sondestekker van het apparaat gescheiden en na het inschakelen van het apparaat worden automatisch na elkaar de statistiekwaarden Min-max-gemiddelde en standaardafwijking van de laatste meetreeksen weergegeven. Mocht u vragen hebben over de laagdiktemeter LAYERCHECK 750 USB, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze laagdiktemeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- LAYERCHECK 750 USB-F werkt volgens de magnetisch-inductieve methode
- LAYERCHECK 750 USB-FN gebruikt zowel de magnetisch-inductieve als de wervelstroom methode.
- Meetmethode conform DIN, ISO, BS, ASTM
- Dataoverdracht via USB-interface
- Grote, verlichte LC-Display
- Kabellengte van de sonde 1m

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de laagdiktemeter LAYERCHECK 750 USB

Meetbereiken	0 - 3000 μm
Model 750 USB-F	0 - 2000 μm (F)
Model 750 USB-FN	0 - 2000 μm (N)
Meetnauwkeurigheid	$\pm (2\% + 2 \mu\text{m})$ van de meetwaarde
Kleinste Krommingradius van het meetobject	konvex: 5 mm konkav: 25 mm
Kleinste Meetvlak	$\varnothing$ 20 mm
Kleinste dikte van de grond werkstof	0,5 mm (F) 50 μm (N)
Display	4-cijferig, Cijferhoogte 11 mm
Meeteenheden	μm – mils omschakelbaar
Kalibratie	Standaard-, 1-punt-, 2-punt-kalibratie
Statistiekberekening	Uit max. 9999 meetwaarden
Geheugen	Gemiddelde, standaardafwijking, aantal meetwaarden, grootste/kleinste meetwaarde
Interface	USB
Stroomvoorziening	3 Micro-AAA-batterijen (>10000 metingen)
Omgevingstemperatuur	Apparaat: 0 - 50 °C Sonde: -10 °C - 70 °C
Afmetingen (L x B x D)	Apparaat: ca. 122 x 70 x 32 mm Sonde: $\varnothing$ 15 mm x 62 mm
Gewicht	ca. 225 g

Inhoud van de levering LAYERCHECK 750 USB-F

1x LAYERCHECK 750 USB-F, 1x Sonde voor metingen van staal, 3x Precisiestandaard (Kalibratiefolie), 1x Referentie-nulplaat (staal), 3x Batterijen AAA, 1x Softtas, 1x Software Msoft7000 basic edition

Inhoud van de levering LAYERCHECK 750 USB-FN

1x LAYERCHECK 750 USB, 1x Combinatiesonde voor metingen op staal en non-ferrometalen, 3x Precisiestandaards (Kalibreerfolie), 2x Referentie-nulplaten (Staal/aluminium), 3x Batterijen AAA, 1x Softtas, 1x Software Msoft7000 basic edition

